



Vortragsankündigung

Am **Freitag, dem 16. Januar 2015, 14⁰⁰ Uhr**, findet im M-Lab (Raum 405, 4. Stock, Gebäude A1 Nord) folgender Vortrag statt.

Geplante Obsoleszenz – oder – wie die Lebensdauer von Produkten gezielt verkürzt wird

Edbill Grote (Geschäftsführer) und Holger Krumme (Technischer Leiter)

HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH, Bensheim

Die Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH – HTV - wurde 1986 als Testhaus gegründet und hat sich als das Hochleistungszentrum für elektronische Bauteile etabliert. Das Produktportfolio umfasst unter anderem die Programmierung elektronischer Bauteile, den Test elektronischer Bauteile und Baugruppen auf allen Fertigungsebenen, die Analyse elektronischer Bauteile sowie deren Langzeitkonservierung. In diesem Zusammenhang besitzt das Unternehmen vielfältige Erfahrung in der Analyse der unterschiedlichsten Schadensbilder elektronischer Produkte.

Sowohl für Endkunden als auch für Hersteller stellen sich Fragen nach der Produktlebensdauer. Werden heutzutage gezielt Sollbruchstellen in Produkte eingebaut, so dass die Lebensdauer absichtlich begrenzt wird? Ist dies wirtschaftlich erforderlich, um kontinuierlich neue Umsätze zu kreieren oder im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes langfristig betrachtet weniger intelligent? Ist dies ökonomisch und ökologisch sinnvoll? Das Unternehmen HTV widmet diesen Fragen bereits seit mehreren Jahren seine Aufmerksamkeit und thematisiert diese in der Öffentlichkeit.

Der Vortrag zeigt konkrete Beispiele der Lebensdauerverkürzung an Produkten des täglichen Lebens. Prüfzeichen und zugehörige Prüfmethode und -verfahren als Möglichkeit zur Erkennung von Produkten mit Schwachstellen werden erläutert.

Zusätzlich wird auf die Frage eingegangen, inwiefern Produkttests für die Bewertung „geplanter Obsoleszenz“ geeignet sind.

Die Dauer der Präsentation beträgt ca. 60 Minuten plus Diskussion. Die Veranstaltung ist öffentlich, und alle Interessenten sind dazu herzlich eingeladen.